



D5 - MEB

PRINCIPE	Observation d'un échantillon soumis à l'action d'un canon à électrons, sous atmosphère contrôlée (température et humidité relative de la salle blanche, vide possible dans la chambre objet). Permet par exemple de déterminer le taux surfacique de fibre ou de matrice contenu dans un composite.	
TYPE/REF	JSM 5310 / N°MP 17210037	
CONSTRUCTEUR	JEOL	
CARACTERISTIQUES	Electrons secondaires et rétrodiffusés Système de vide Appareil photo Polaroid 545i	
CAPACITES	Grandissement	x15 à x200 000
	Chambre objet	Ø 125 mm
	Vide	Pression ultime 7.10^{-4} Pa
PRECISION	Résolution	4.5 nm
PILOTAGE	Logiciel « WIN SCAN PC » : pilotage du MEB Logiciel « PERFECT IMAGE » : analyseur d'images Logiciel Freeware « ImageJ » : analyseur d'images	

